

Model : FLA-200

非接触式（静電容量法）ウエハフラットネス測定システム



厚さ・TTV・BOW・Warp・サイトフラットネス・
グローバルフラットネスの測定に対応（ASTM準拠）

機能・特長

- 厚さ・TTV・BOW・Warp・サイトフラットネス・グローバルフラットネスを測定に対応（ASTM準拠）
- 2-D/3-Dマッピング画像表示
- 測定データはCSVファイル形式で出力可能
- 5mmφコア静電容量式プローブによる、高精度測定
- 12,000点スキャン/60秒以内の高速測定
- オプション：300mmウエハ対応（Model : FLA-300）

測定対象

- 材質： Si, GaAs, Ge, SiC, InPを含む半導体物質
- サンプル表面： アズカット, ラップ, エッチング, ポリッシュ, パターンなど
- オリフラ/ノッチ： SEMI規格サンプルに対応
*SEMI規格のシングルフラット品に対応
- 導電型： P または N 型

対象サイズ

75~200mm（3~8インチ）
[*FLA-300 : 150,200,300mm（6,8,12インチ）]

測定レンジ・表示項目

測定項目	測定レンジ
Thickness	200 ~ 1200 μm
BOW	+/- 350 μm
WARP	350 μm

<サイトデータ>

厚さ（中心点、最大値、最小値、平均値）, SBID, SBIR, SF3D, SF3R, SFLD, SFLR, SFQD, SFQR

<グローバルデータ>

GF3D, GF3R, GFLD, GFLR, Bow-3P, Bow-BF, Warp-3P, Warp-BF, Sori-3P, Sori-BF, FPD%, Taper, Roll off

A global leading company for resistivity measurement system.



ソフトウェア機能

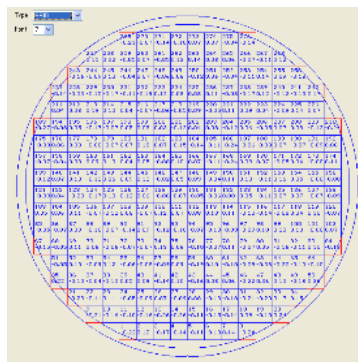
・測定結果を2-D(等高線)/3-Dマッピンググラフで表示

Site No.	Center Position		Thickness				SBID	SBIR	SF3D	SF3R	SFLD	SFLR	SFQD	SFQR
	X	Y	Center	Max	Min	Ave								
1	-35.00	-85.00	748.00	748.21	747.78	747.99	-0.22	0.43	-0.22	0.40	-0.23	0.41	0.02	0.03
2	-25.00	-85.00	748.21	748.33	748.15	748.23	0.12	0.18	0.10	0.19	0.11	0.19	-0.03	0.06
3	-15.00	-85.00	748.16	748.23	747.99	748.14	-0.17	0.26	-0.14	0.20	-0.15	0.21	-0.02	0.03
4	-5.00	-85.00	748.06	748.12	747.92	748.01	-0.14	0.20	-0.13	0.17	-0.14	0.18	0.02	0.03
5	5.00	-85.00	748.05	748.03	747.94	748.03	-0.11	0.15	-0.14	0.20	-0.14	0.21	0.03	0.05
6	15.00	-85.00	748.10	748.13	748.00	748.08	-0.10	0.12	-0.07	0.11	-0.08	0.12	-0.04	0.05
7	25.00	-85.00	747.99	748.11	747.93	748.01	0.14	0.18	0.11	0.15	0.11	0.16	0.02	0.03
8	35.00	-85.00	747.87	748.10	747.62	747.84	-0.24	0.47	-0.26	0.51	-0.27	0.52	0.03	0.05
9	-55.00	-75.00	748.45	748.65	748.23	748.44	-0.21	0.42	0.20	0.39	0.21	0.41	-0.03	0.04
10	-45.00	-75.00	748.43	748.54	748.27	748.43	-0.16	0.26	-0.14	0.22	-0.15	0.23	0.04	0.08
11	-35.00	-75.00	748.44	748.53	748.35	748.45	-0.10	0.19	-0.12	0.19	-0.12	0.19	-0.02	0.04

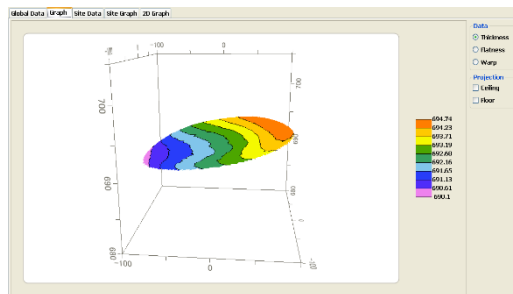
Thickness	Judgement	Item	Judgement
Center	NG	SBID	OK
Maximum	NG	SBIR	OK
Minimum	NG	SF3D	OK
Average	NG	SF3R	NG
		SFLD	OK
		SFLR	NG
		SFQD	OK
		SFQR	OK

Item	Data	Judgement
SFPDW	46.01	OK
STIRW	100.00	NG

ソフトウェア：メイン画面



サイトイメージ



2-Dマッピング

測定仕様

測定項目	測定精度	測定再現性
Thickness (ASTM F533)	+/-0.5μm	0.15μm
TTV (ASTM F657)	+/-0.5μm	0.15μm
Bow (ASTM F534)	+/-3μm	1μm
Warp (ASTM F1390)	+/-3μm	1μm
Flatness [site] (ASTM F1530)	+/-0.15μm	0.05μm
Flatness [global] (ASTM F1530)	+/-0.15μm	0.05μm

*再現性=σ (10回測定)

*サイトサイズ X,Y = 8 mm ~ 30 mm まで0.1mm間隔で設定可能

*上記の精度・再現性は、弊社所有サンプル (TTV0.5um以下) の測定に基づいています。

測定スループット

測定ポイント数	測定時間
12,113 ポイント (4mm間隔ライン設定)	約 58 sec
10,111 ポイント (5mm間隔ライン設定)	約 53 sec
5,406 ポイント (10mm間隔ライン設定)	約 41 sec

*測定時間は参考です。設定条件・サンプルサイズなどにより変動致します。

- 詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 実機でのサンプル測定が可能です。お気軽にご相談下さい。
- 記載の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。